

EB滅菌ビジネスの世界動向と 光子発生技術研究所

山田廣成

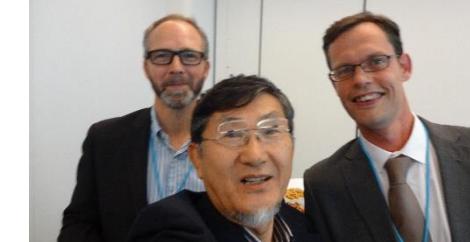
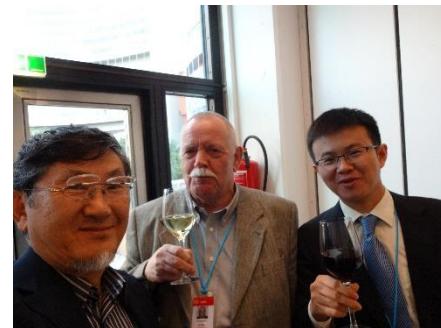
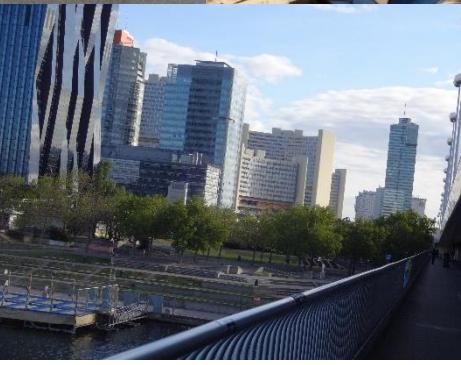
(株)光子発生技術研究所

(株)みらくるセンター

立命館大学特任教授

IAEAワークショップ”New Generation of EB Accelerators for Emerging Radiation Processing Applications”出席報告







**IAEA Technical Meeting on
New Generation of EB Accelerators for Emerging Radiation Processing
Applications**

7-11 September 2015."

**IAEA Headquarters Vienna, AUSTRIA
(M0E03 – Meeting Room - Building M)**

PROVISIONAL AGENDA

Monday, 7 September 2015

Session I: Introductory Session

9.30 - 10.00	Opening of the meeting by: ➤ Mr Aldo Malavasi, (Deputy Director General, Nuclear Applications) ➤ Ms. M. Venkatesh (Director of Division of Physical and Chemical Sciences) ➤ Mr. Mr Joao Alberto OSSO JUNIOR (Head, Radioisotope Products and Radiation Technology Section) ➤ Mr Sunil Sabharwal(Scientific Secretary) Scope and Objectives of the Technical Meeting Election of the Chairperson and reporter Adoption of the agenda
--------------	--

Session II: Participants' Presentations **

10.30 – 11.30	Mr. Philippe DETHIER – Belgium <i>New 2nd generation Rhodotron</i>
11.30 – 12.30	Mr. Wilson CALVO - Brazil <i>Mobile Unit with an Electron Beam Accelerator to Treat Industrial Effluents for Reuse Purposes in Brazil</i>
14.00 – 15.00	Mr. David BROWN - Canada <i>Title to be received</i>

Tuesday, 8 September 2015

Session II

Participants' Presentations **

09.30 – 10.30	Mr. André WEIDAUER - Germany <i>Electron treatment of seed: an environmental friendly Treatment method with future potential</i>
10.30 – 11.30	Mr. Hironari YAMADA – Japan <i>Title to be received</i>
11.45 – 12.45	Mr. Bumsoo HAN – Korea, Republic of <i>Requirements of Electron Accelerator for Environmental Application</i>
14:00-15:00	Mr. Andrez CHEMILIEWSKI – Poland <i>Accelerators for the future research, industry and environmental applications</i>
15.00 – 16.00	Mr. Z.Zimek – Poland <i>Reliability and availability of high power electron accelerators for radiation processing</i>
16.30 – 17.30	Mr. Aleksandr Bryzgin – Russia <i>ILU accelerators for EB and X-ray</i>

Wednesday, 9 September 2015

Session III

Participants' Discussion : ALL PARTICIPANTS

9:30-10:30	Mr Urs V.LAUPPI – Switzerland <i>Permanent sealed, compact ebeam engine</i>
10:30-11:30	Mr Peter MCINTOSH – United Kingdom <i>Title to be received</i>
11:45 – 12:45	Mr Robert Kepher – United States of America <i>Title to be received</i>
14.00 – 15.00	Mr. Peng WEI - China <i>The development and outlook of the EB irradiation facilities and their applications in China</i>
15.30 – 17.30	<i>Discussion "Emerging scenario of electron beam applications"</i>

Thursday, 10 September 2015

Session IV

Discussion and Initiating Preparation of Technical Document;- ALL PARTICIPANTS

09.30- 11.00	<i>Discussion "New generation accelerators – meeting techno-commercial needs of emerging applications"</i>
11.30 – 13.00	<i>Discussion "Strategies for enhancing deployment of EB technologies: enhancing mutual cooperation among stakeholders and the potential IAEA role"</i>
14.00 – 15.30	<i>Preparation of a technical report : scope/contents/structure of the meeting report/conclusions/recommendations</i>

CONCLUSIONS

- 1) EBの利用はは産業利用及び環境保全で増加している。
- 2) 国やIAEAによりEB技術をラボからインダストリーへ移転する強力なプログラムが必用である。
- 3) ユーザーとサプライヤーの繋がりを強化する必要があり、IAEAは重要な役割を果たすことができる。
- 4) 低エネルギーEBはインク定着、コーティング、接着剤として需要が増加している。
- 5) 10KW以上のEBを必要とする多くのアプリケーションがあるが、低コストで、高い加速効率を有し、簡単なオペレーションが望まれる。既存のEB装置は、パフォーマンスや、信頼性を向上させる必要がある。
- 6) 5MeV以上で、MWクラスのEBを必要とする多くのアプリケーションがある。
- 7) タイヤのクロスリンクや種子表面の殺菌、農地の滅菌、排水の滅菌において、開発途上国で大きな需要がある。

8) The
industri
remedi
9) Sm
applica
10) La
majorit
builder:
Americ
Program
11) Re
supercl
develop
power,
operati
12) Th
and rad

ations:
velop
ne
ator
es of
e
h
ilities
s.

- 8) 移動式のEB装置に需要が有る。汚染水の処理や環境の保全には移動式が必用である。
- 9) 移動式のEBや小型EBはさらに需要を探すことができる。
- 10) 多くの国で、ビッグサイエンスで加速器に巨大な予算が付けられている。そして、多くの場合、産業とラボのコネクションは強いとは言えない。
- 11) 超電導リナックの様な革新的な加速器技術は加速器の小型化や低コスト化に貢献すると思われる。
- 12) IAEAは産業用加速器プロバイダー、放射線化学ラボと繋がりがあるが、もっと強化するのが良い。

Target Audience

Radiation science and technology is a multidisciplinary area that covers many branches such as radiation-related physics, chemistry, materials science, biology, engineering and industrial applications. Accordingly, the target audience for this conference comprises but is not limited to:

- Radiation technology professionals
- Entrepreneurs or stakeholders involved in applications of radiation technologies
- Research scientists engaged in radiation research
- Policy makers and regulators

Participation and Registration

No registration fee will be charged to participants. The IAEA is generally not in a position to bear the travel and other costs of participants in the conference. The IAEA has, however, limited funds at its disposal to help meet the cost of attendance of certain participants.

All persons wishing to participate in the conference are requested to register online in advance through the conference web page and send a completed Participation Form (Form A), and if applicable, the Form for Submission of a Paper (Form B) and the Grant Application Form (Form C) to their competent national authority (e.g. Ministry of Foreign Affairs or National Atomic Energy Authority), or to one of the organizations invited to participate, for subsequent electronic transmission to the IAEA (Official.Mail@iaea.org).

Working Language

The working language of the conference will be English.

Key Deadlines

Submission of abstract (including Form A and B)	30 June 2016
Submission of Grant application (Form A and C)	30 June 2016
Notification of Acceptance of abstract	End of July 2016
Submission of full papers	end of October 2016

Submission of Abstracts

Abstracts must be sent in electronic format (no paper copies) directly to the IAEA. Instructions on how to upload the abstracts to the conference's web browser-based file submission system (IAEA-INDICO) will be available on the conference web page as of February 2016. No other form of submission will be accepted.

Exhibition

A limited amount of space will be available for commercial vendors' displays/exhibits during the conference. Interested parties should contact the Scientific Secretariat by email at: icarst2017@iaea.org by 30 June 2016.

Scientific Secretary

Mr João Alberto Osso Júnior
Division of Physical and Chemical Sciences
Department of Nuclear Sciences and Applications
Tel.: +43 1 2600 21748
Email: icarst2017@iaea.org

Administration and Organization

Ms Julie Zellinger
Conference Services Section
Division of Conference and Document Services
Department of Management
IAEA-CN-249
Tel.: +43 1 2600 21321
Email: J.Zellinger@iaea.org

Conference Web Page

www-pub.iaea.org/iaeameetings/50814/International-Conference-on-Applications-of-Radiation-Science-and-Technology-ICARST-2017



ICARST2017
International Conference on
Applications of Radiation Science
and Technology (ICARST-2017)

IAEA Headquarters
Vienna, Austria
24–28 April 2017

IAEA-CN-249

IAEA
International Atomic Energy Agency
Atoms for Peace

The scope of the conference is meant to cover, but is not limited to, the following topical areas:

- Recent advances in radiation chemical sciences
- Current radiation technology trends
- Setting up of new radiation facilities
- Production and transportation of cobalt-60
- New generation electron beam accelerators and X-ray sources
- Radiation sterilization
- Radiation modification of polymeric materials
- Radiation chemistry in the synthesis and design of nanomaterials
- Development of advanced materials using radiation technology
- Surface curing using radiation technologies
- Radiation treatment of gaseous pollutants, industrial wastewaters, municipal wastewater, sludge and emerging organic pollutants
- Use of radiation technology for cultural heritage imaging and preservation
- Radiation chemical aspects related to water coolant systems in nuclear reactors, fuel reprocessing and nuclear waste management
- Operational experience from radiation facility operations
- Radiation dosimetry
- Implementing quality management practices for the control of radiation processes
- New generation safety and control features in radiation facilities
- Applications of tracers and radiotracers for studying industrial and environmental processes
- Thin layer activation method for wear measurement
- Nucleonic control and measurement systems
- Radiation detection techniques and equipment
- Computational fluid dynamics and numerical modelling of residence time distribution
- Radiation based imaging technologies
- Economic aspects of radiation technologies vis-à-vis conventional technologies
- Educational tools and methods for human resource development in this field

実用の時代を迎えた 卓上型放射光装置



Photon Production Laboratory



Japanese

Home

Site Map

contact

Home

Products

MIRRORCLE

Service

Documents

Company

Contact

"MIRRORCLE" X-ray technology
solves the problems you could not manage before.

■ X-ray CT

■ XRD & SAXS

■ Non-Destructive Testing







卓上型シンクロトロンでハイパワー放射光を実現
遠赤外線、EUV、軟X線、硬X線、MeV領域 γ 線の利用が可能
微細構造の分析は光子研にお任せください
新しい分析・検査手法を提案いたします



金属内部の残留応力を測定します

残留応力は、表面ではゼロでも内部に蓄積します



中性子を使わなくても
軽元素・重元素の密度分布がわかります
チタンとチタン酸化物の違いを識別・セラミックスの品質管理に最適



産業用CTで0.3mm解像度を実現

解像度0.3mmでSTLデータを出力します自動車の大型部品や蓄電池・燃料電池の欠陥解析に威力を発揮



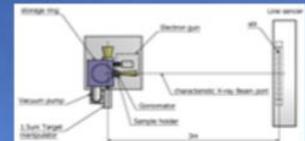
60cm厚コンクリートの診断を行います

床版の検査を深さ30cmまで可能にする研究を進めています



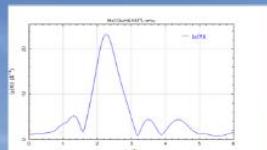
サブミクロンX線顕微CT装置を開発中

従来装置で2時間かかる撮影を10分で行います



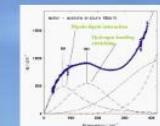
EXAFSで化学状態を分析します

蓄電池材料や触媒の開発に威力・環境化学物質の分析にも適しています

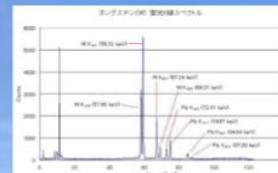


水溶液のテラヘルツ分光が可能な民間で唯一の装置です

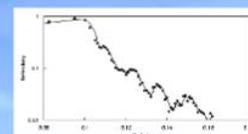
テラヘルツ放射パワーは大型放射光を凌ぎます



全元素の蛍光X線分析をPPMオーダーで実現 TXRF(全反射法)を用います



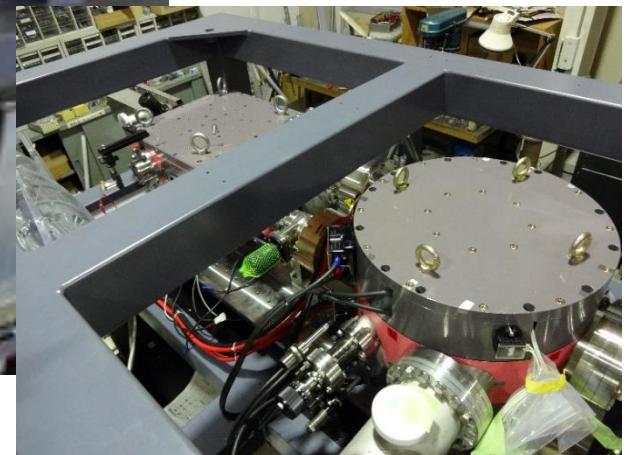
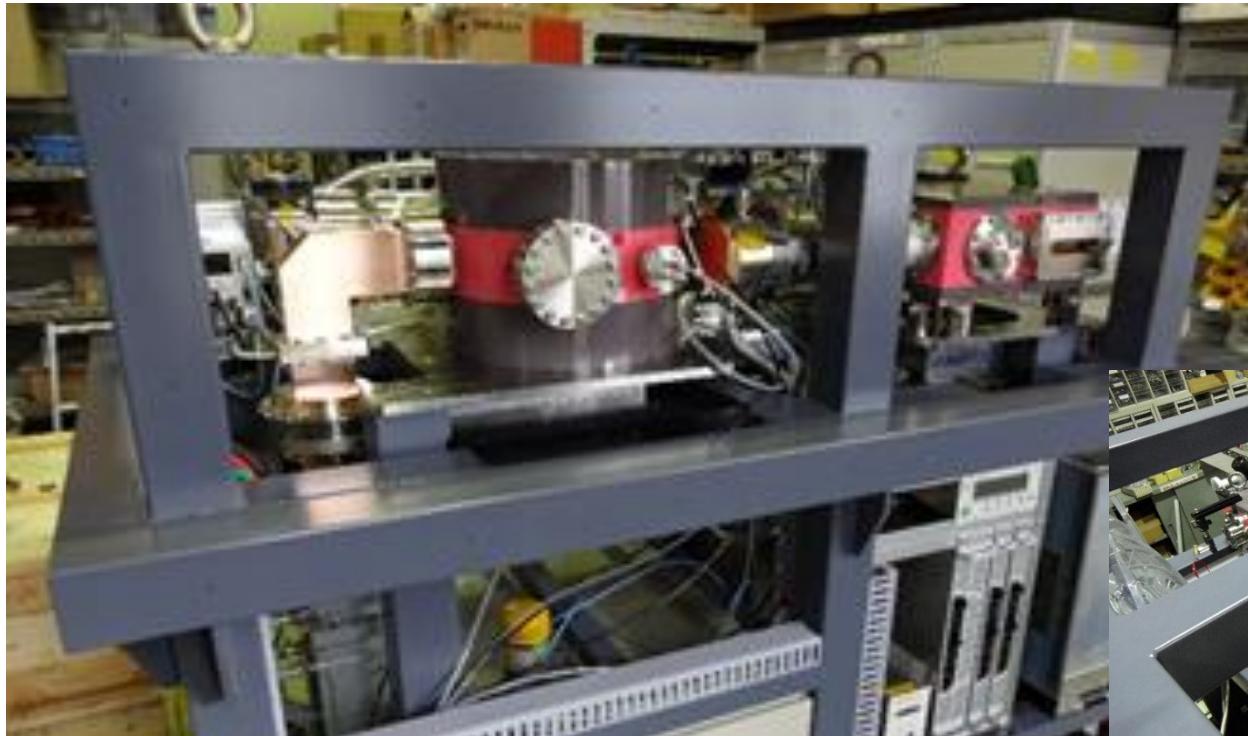
小角散乱で粒子サイズや膜厚がわかります
タンパク質の形状測定にも利用できます



マイクロトロンは小型ハイパワーの滅菌・殺菌装置に最適です
10MeV-40kWの滅菌装置を提供します

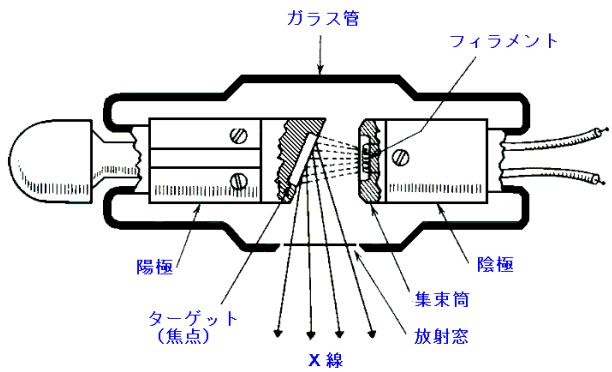


The latest machine MIRRORCLE-CV4 HP model produced last year for HITACHI Ltd.



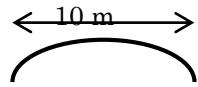
MIC1-CT system installed in a factory





エックス線管の構造

大電流ではターゲットが溶けるため、
X線フラックスには限界がある。



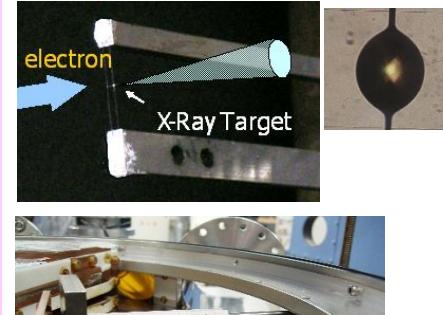
磁場で電子を曲げて
制動放射を発生

蛍光X線は
原子が放出
するので
360° 方向
に出る

MIRRORCLEのX 線発生機構

ターゲットのクーロン力
で電子を曲げて制動放
射を発生

ターゲットが微小である
ため発熱が起こらない。



1. 数keVから数10MeVまでの連続X線を発生

分光して様々な高度分析を実現 XAFS, 小角散乱、残留応力測定
透過力の高いX線で非破壊検査が可能

2. 世界最小光源点を実現

ミクロンサイズの解像度でCTが可能

3. 大きな発散角

大型構造物の非破壊検査が可能
高精度医療診断を実現

X-ray CT system

sample

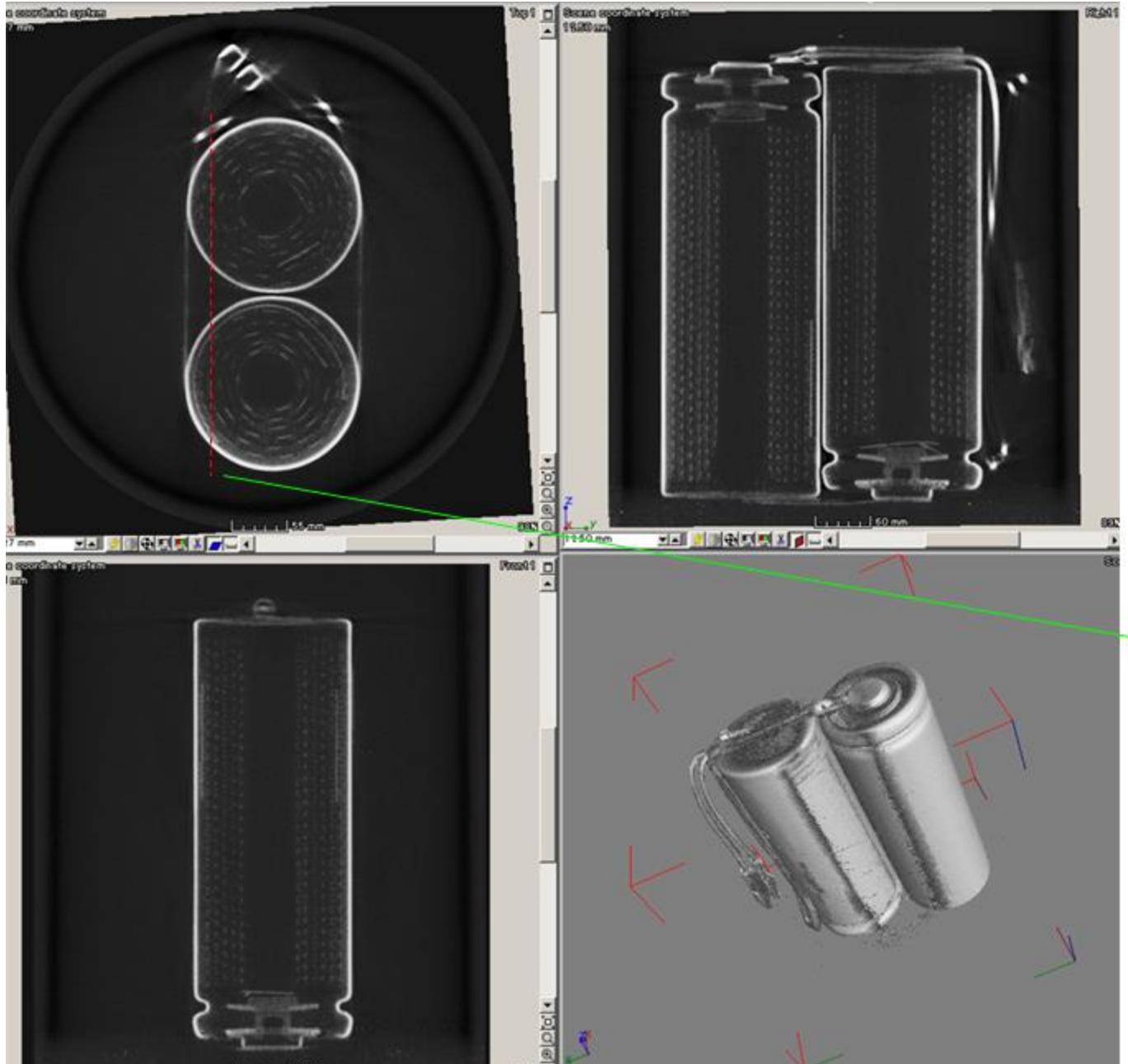


X-ray port



Flat panel detector

Li電池のCT

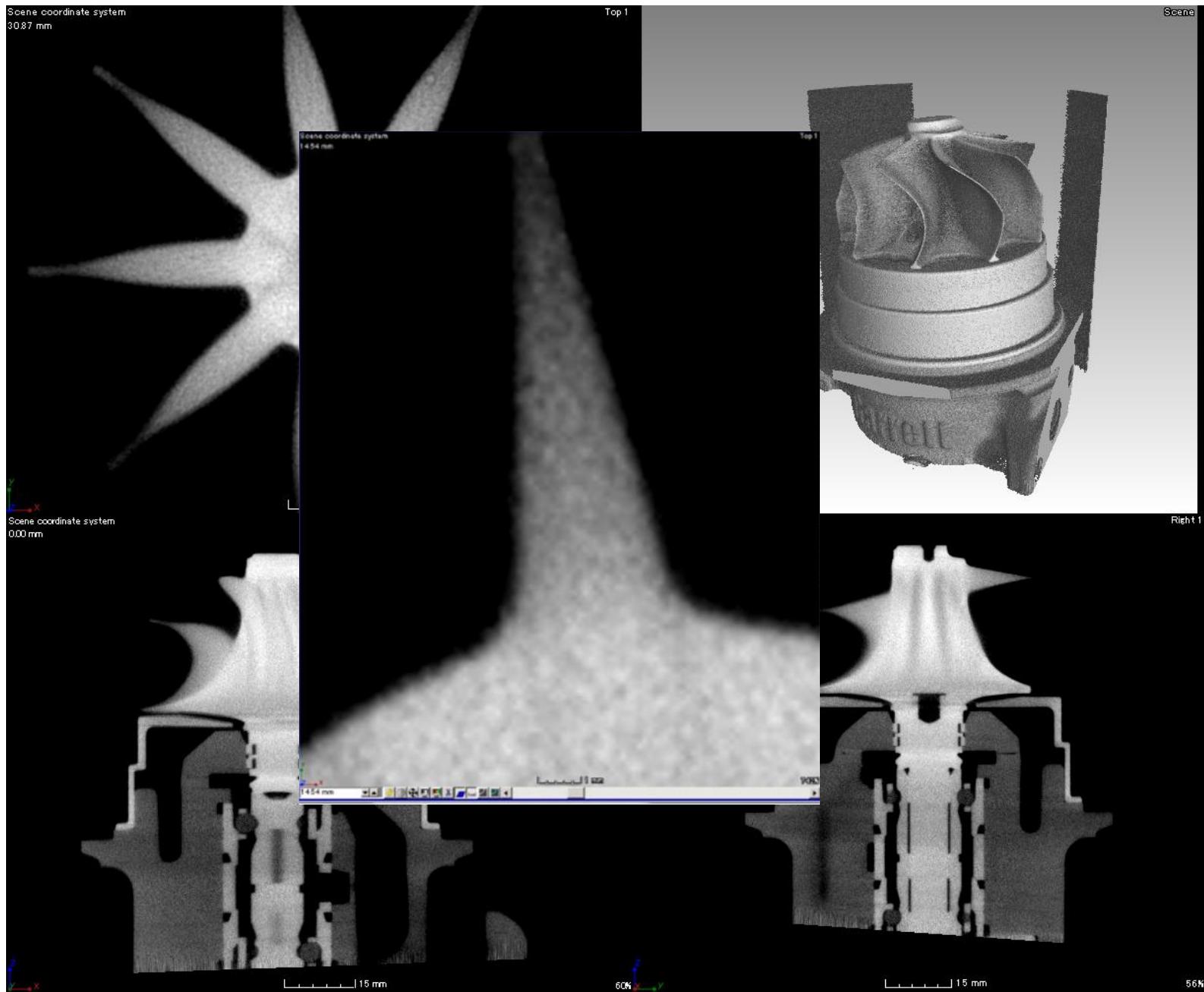


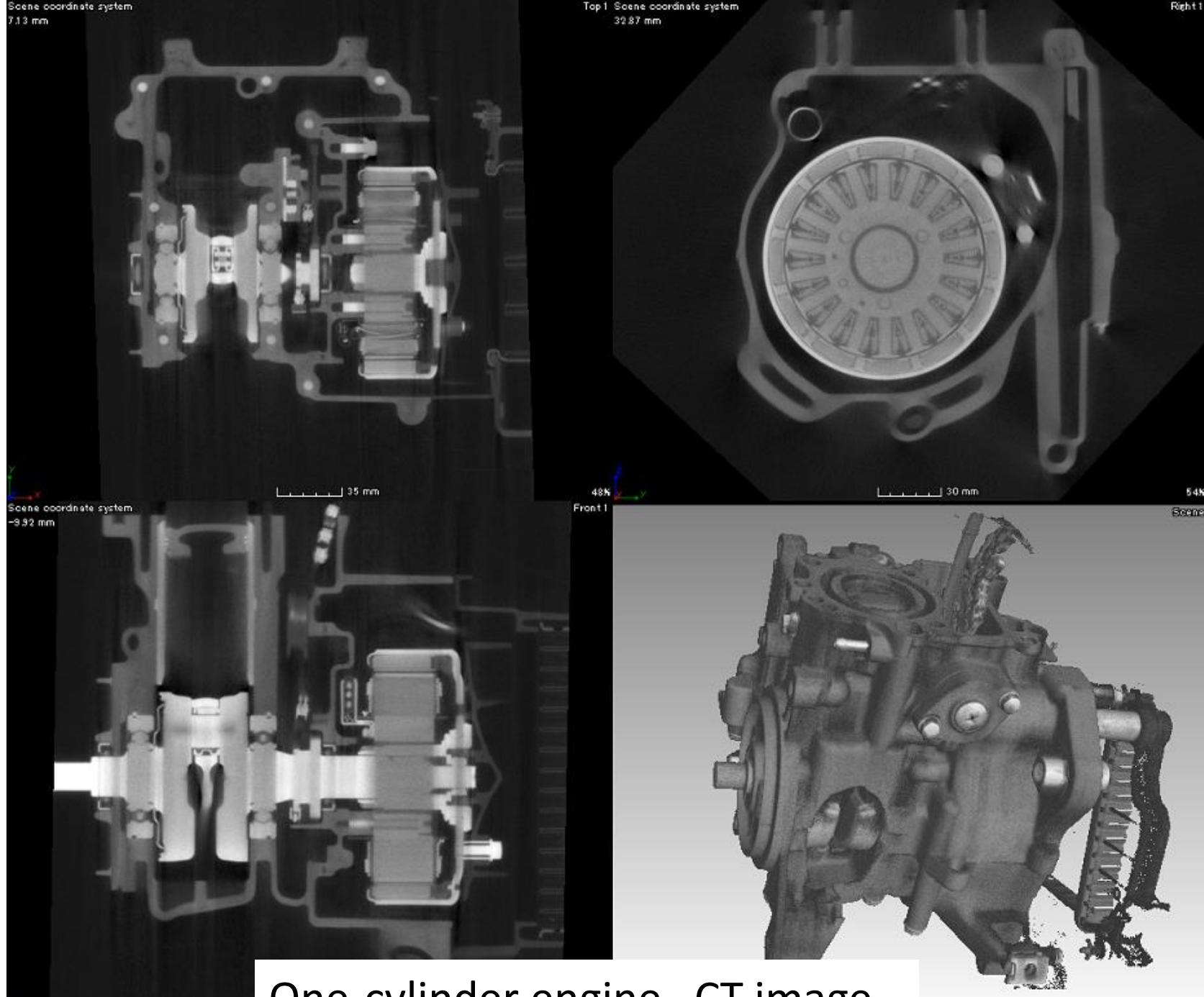
500Hz, 200mA
Target : W39s
S-O:550 mm
S-D:2600 mm
FP 1 sec./frame
360° / 600 frame

内部の電極の様子
がかなりきれいに
撮影できた。



内部電極が網目状
になっていることも
確認。

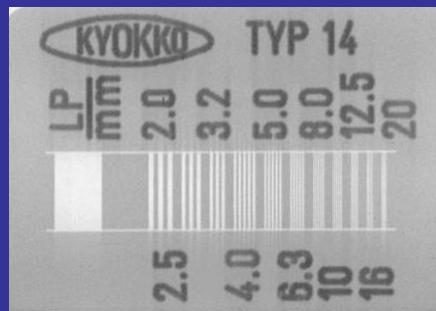




One-cylinder engine CT image

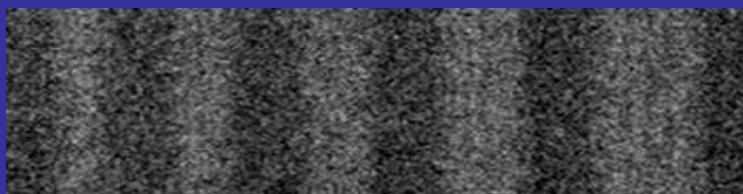
MIRRORCLE-6Xの解像度測定

検出器: $150 \mu\text{m}/\text{pixel}$ イメージングプレート

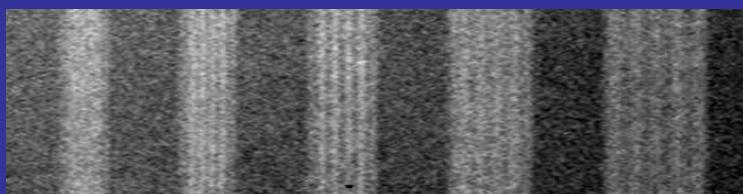


11倍拡大

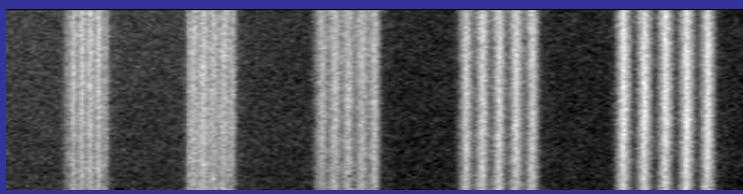
Pb1mm
Point



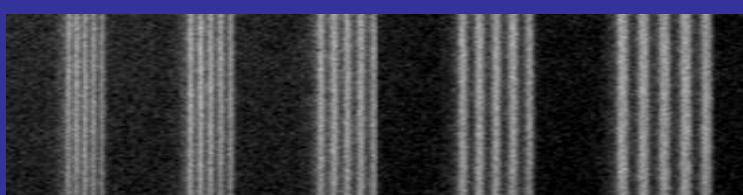
Pt100 μm
Point



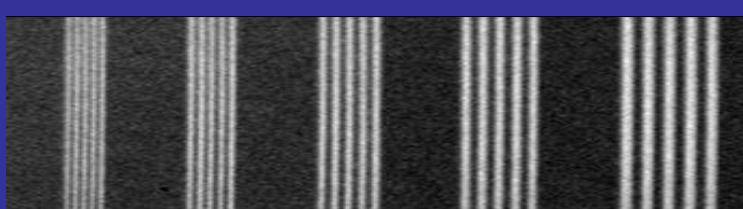
Gu25 μm
Point



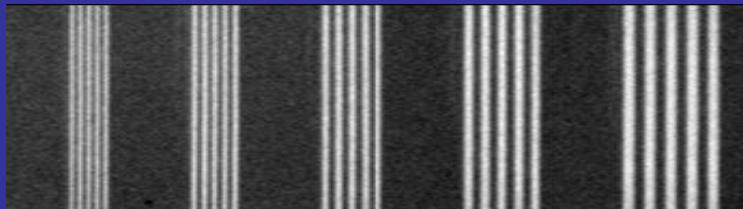
W10 μm
Point



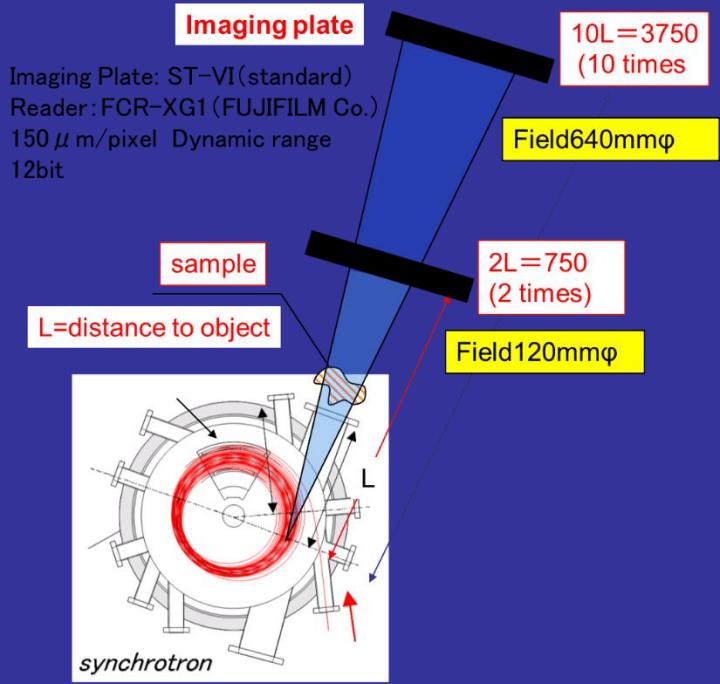
W10 μm
Line



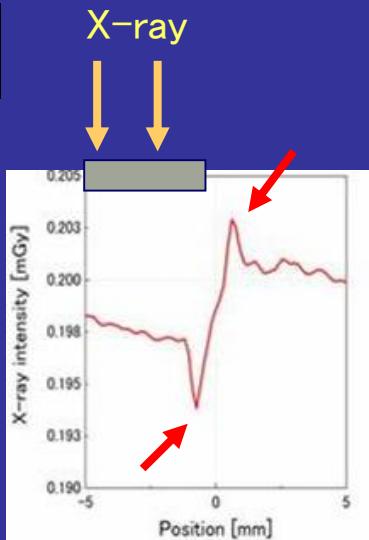
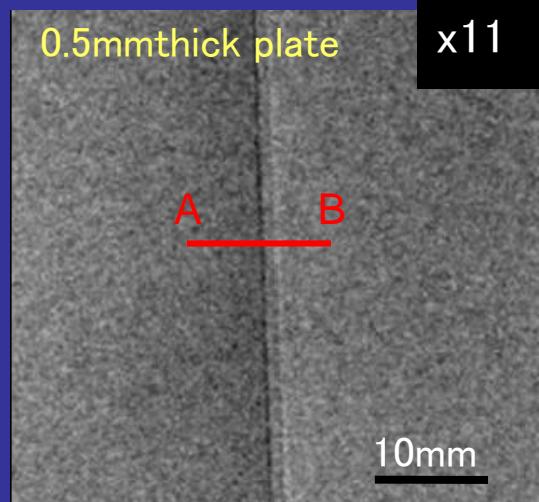
W2.5 μm
Line



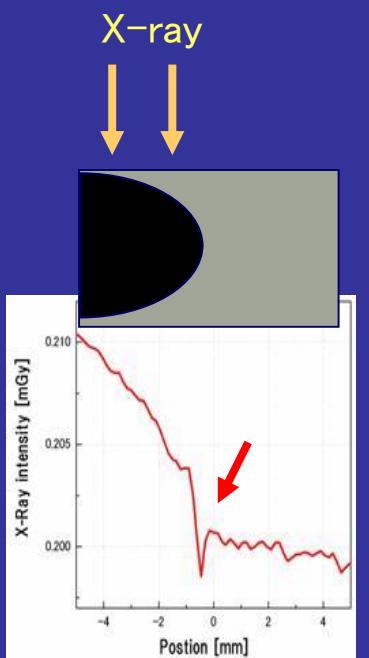
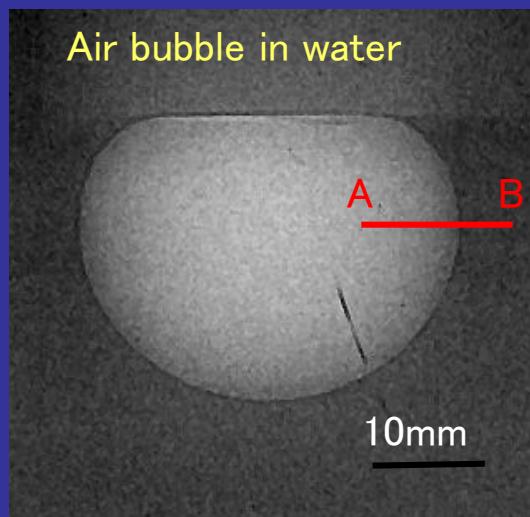
25 31 40 50 63 [μm]



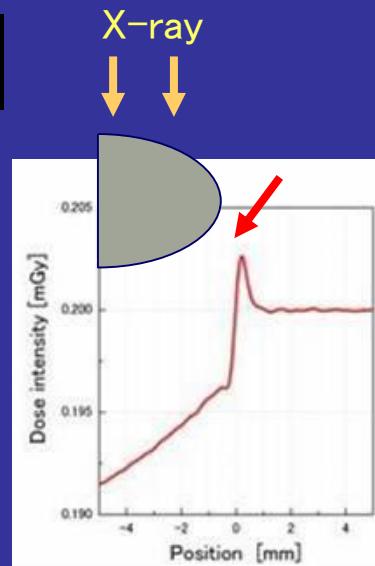
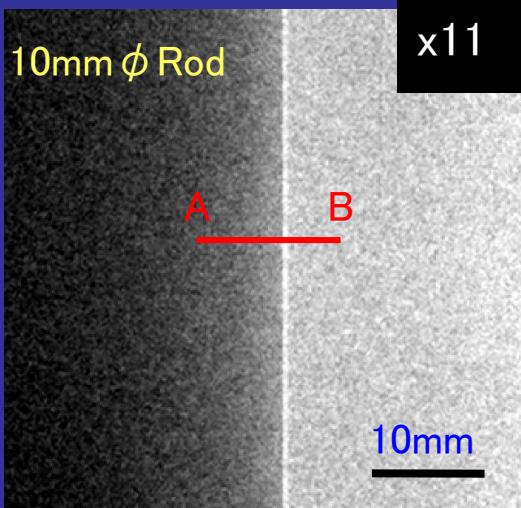
Shape dependence of edge effect



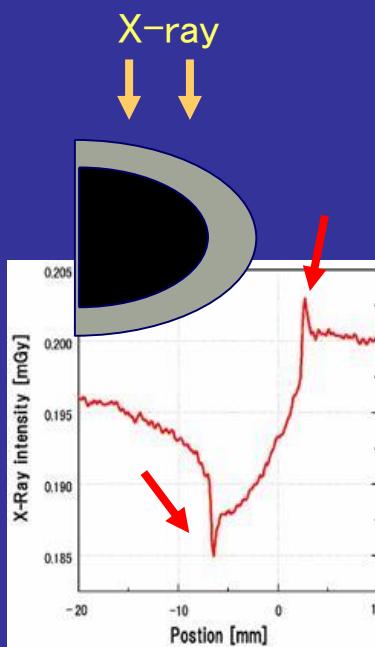
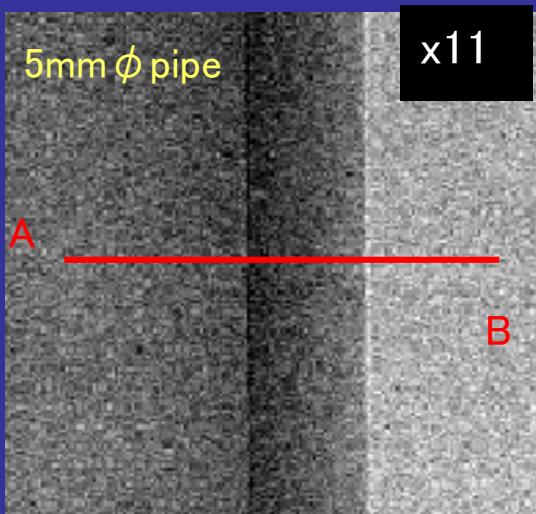
Plane sample
target: W10 μ m ϕ Wire



凹 shape
target: Cu25 μ m ϕ Rod



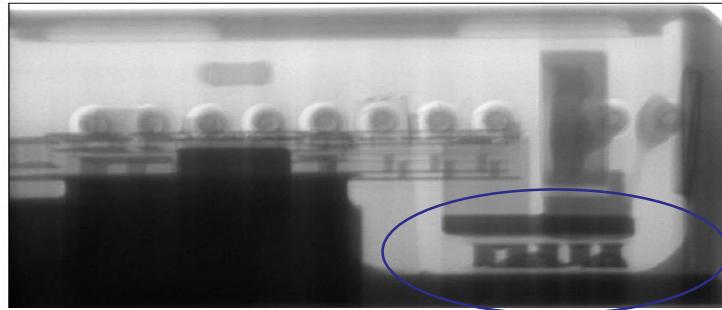
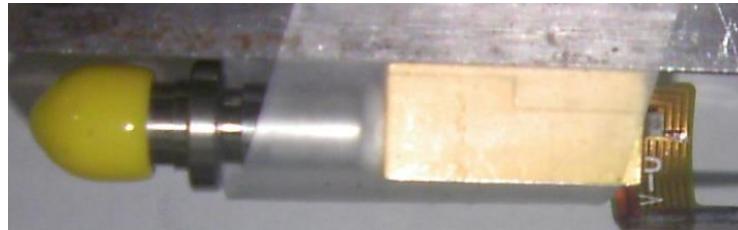
□ shape
target: W10 μ m ϕ Wire



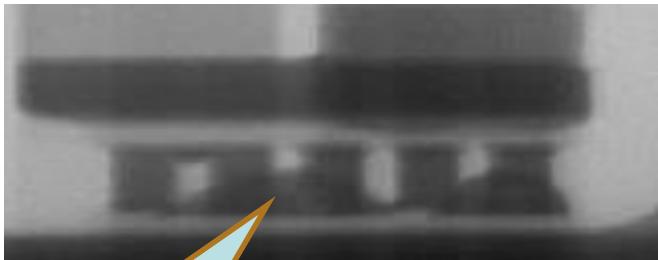
凹凸 shape sample

target: W10 μ m ϕ Wire

非破壊検査事例



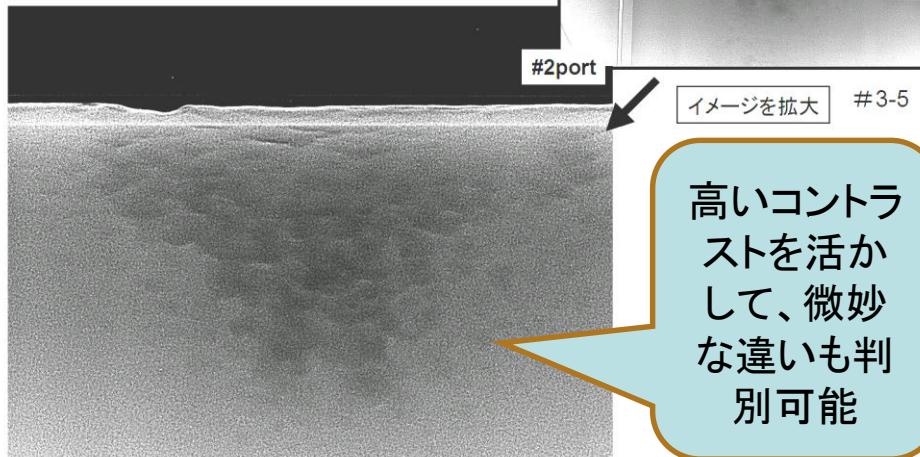
ペルチェ素子



金属内部の
接着剤が見える

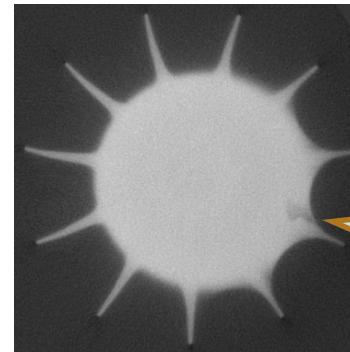
150mm φ 腐食钢管0deg.
X2拡大イメージ

拡大効果



金属配管の腐食部分の撮影

Ti製 タービンブレード

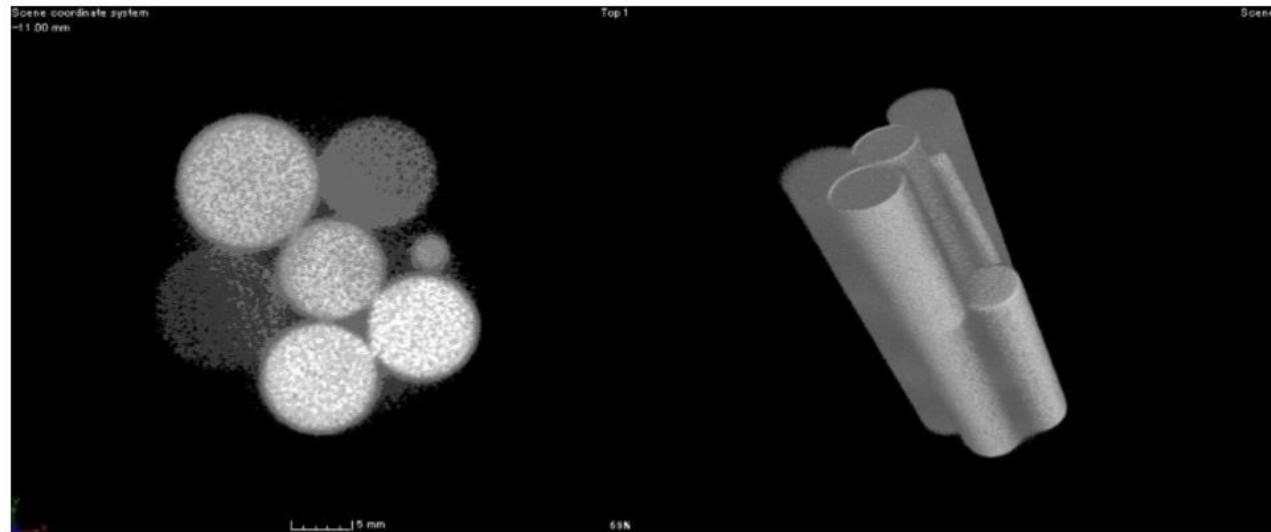


窒化チタン
が見え見える
密度差を識別

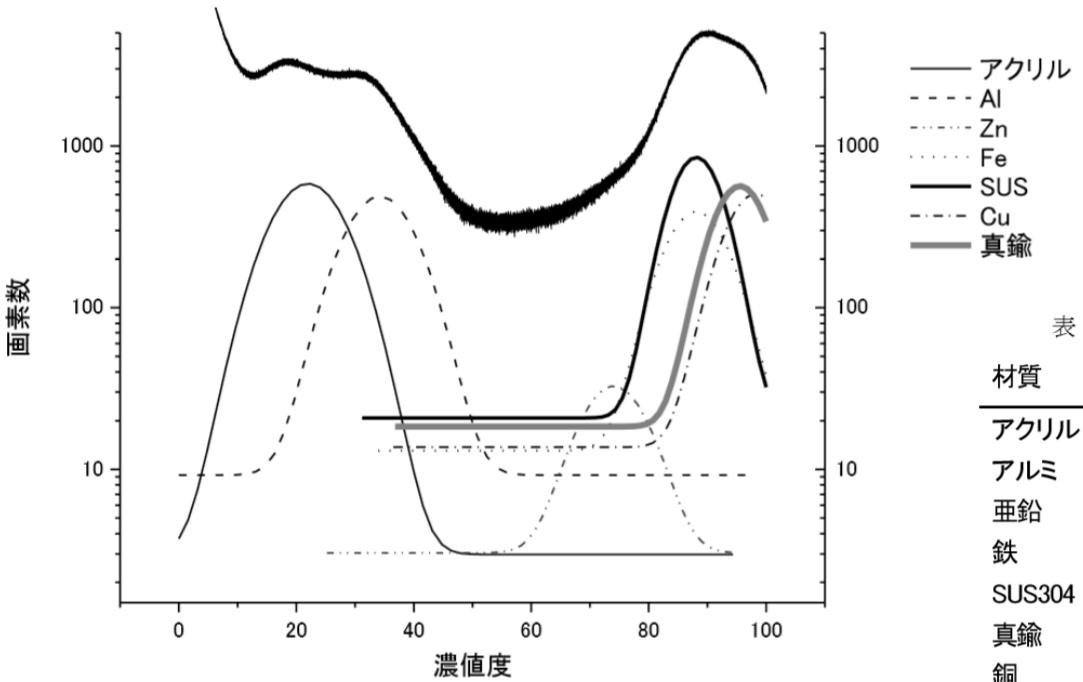
密度分布測定

CT撮影などX線を用いた透過画像では、密度差はコントラストの差として表れる。通常の透過画像では被写体の厚みの情報も含まれるため、単純にコントラストの差が密度差であるとは断定できないが、CT撮影の場合は断層画像を取得できるため、コントラストを比較することで、それぞれの密度を算定することができる。

実際にMIC6-CTシステムでどの程度の密度分解能があるかを評価した。サンプルには7種類のロッド(アクリル、アルミ、亜鉛、鉄、SUS304、真鍮、銅)を束ねて一度に撮影を行った。そのCT撮影結果を第2図に示した。第2図はロッドの断面図と3D画像である。



第2図 異種ロッドのCT撮影結果



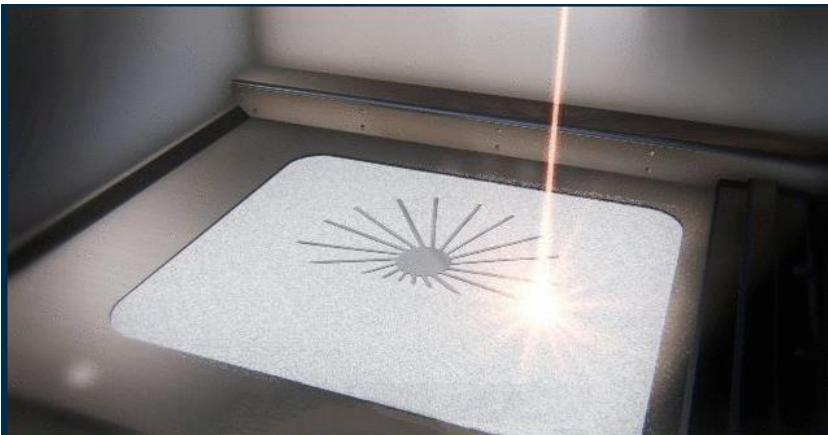
第3図 ロッドのCT画像から得られたグレイバリューのヒストограм

表1 材質の違いによるCT画像のグレイバリューの比

材質	密度 / g/cm ³	密度の比	グレイバリューの比
アクリル	1.2	0.13	0.22
アルミ	2.67	0.3	0.35
亜鉛	7.14	0.8	0.76
鉄	7.8	0.88	0.9
SUS304	7.9	0.89	0.9
真鍮	8.5	0.96	0.98
銅	8.9	1	1

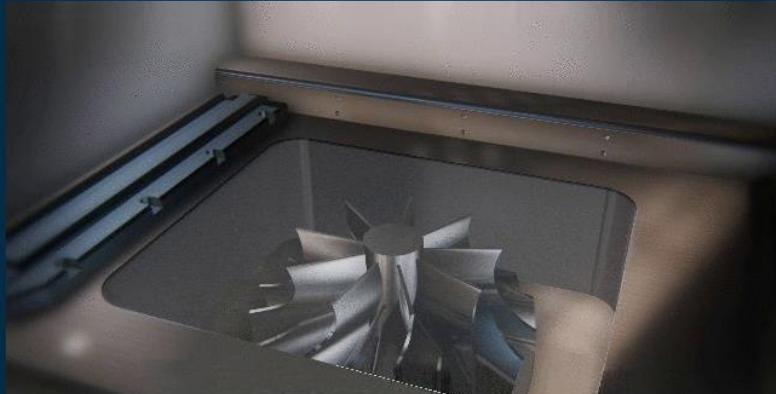
コンプトン散乱は、電子密度に依存しZには依らない
ので、密度測定に適している

第3次産業革命 が始まっている



SLM セレクティブレーザーメルティング

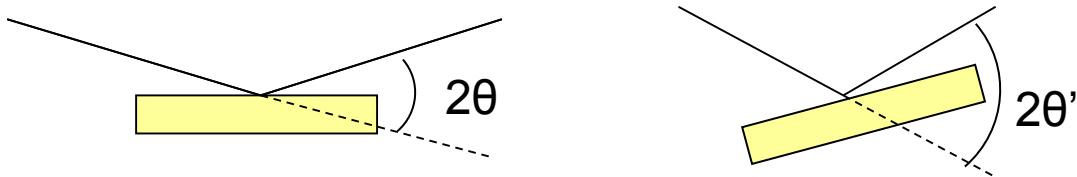
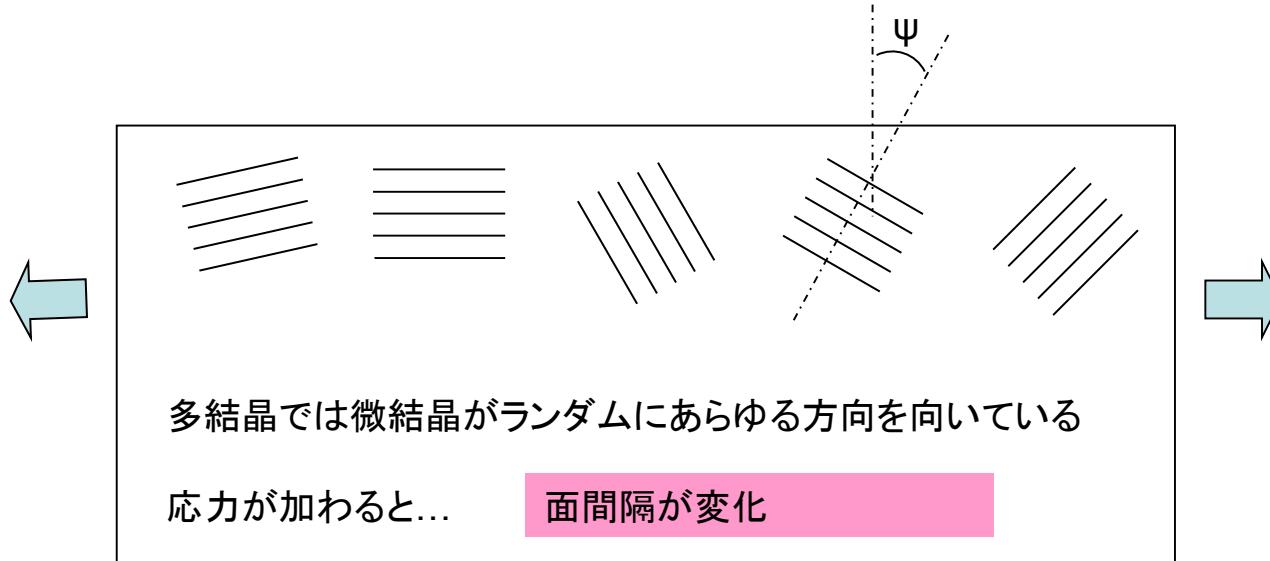
この技術の特徴は、材料粉末を敷き詰めたパウダーベッドにレーザーを照射し、任意の部分を溶融させ、積層させることです。
主に一体構造の製品や部品、ゼロから作らなければならない製品造形に向いています。



材料深部の残留応 力測定実施例

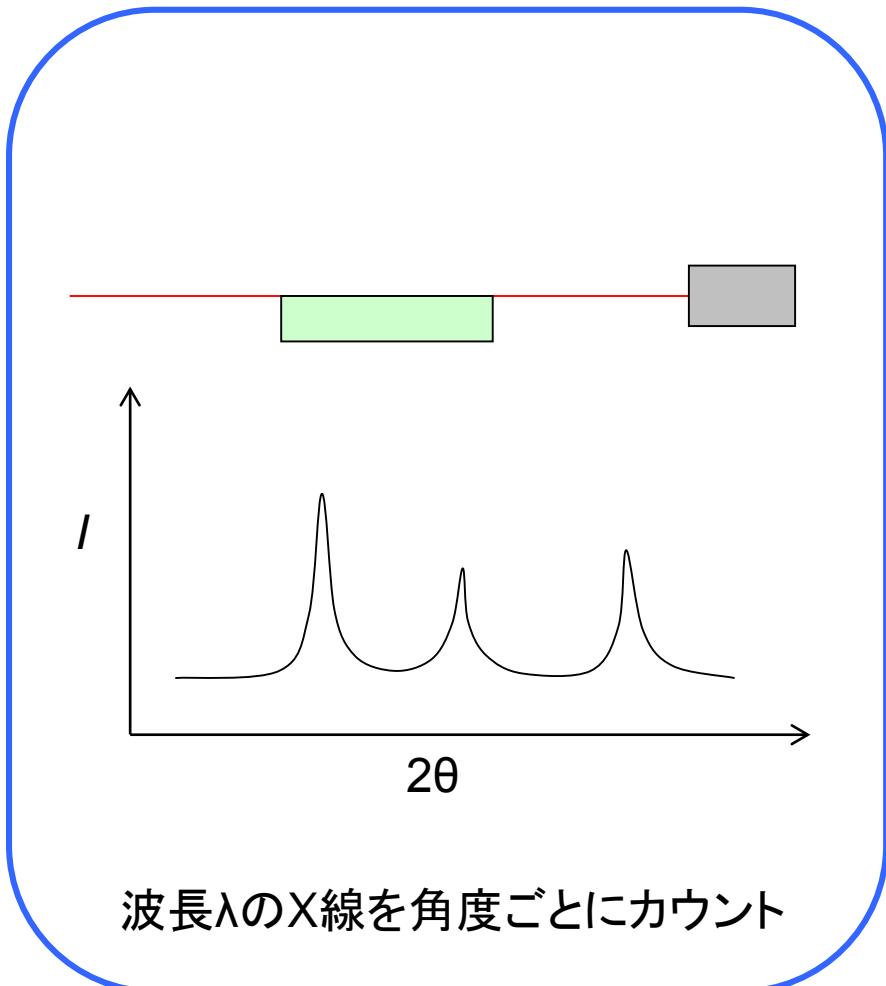
X線残留応力測定原理

X線回折法を用いて、材料の回折ピークを観測し、
材料の向きを変化させたときのピークのシフト量から残留応力を求める。

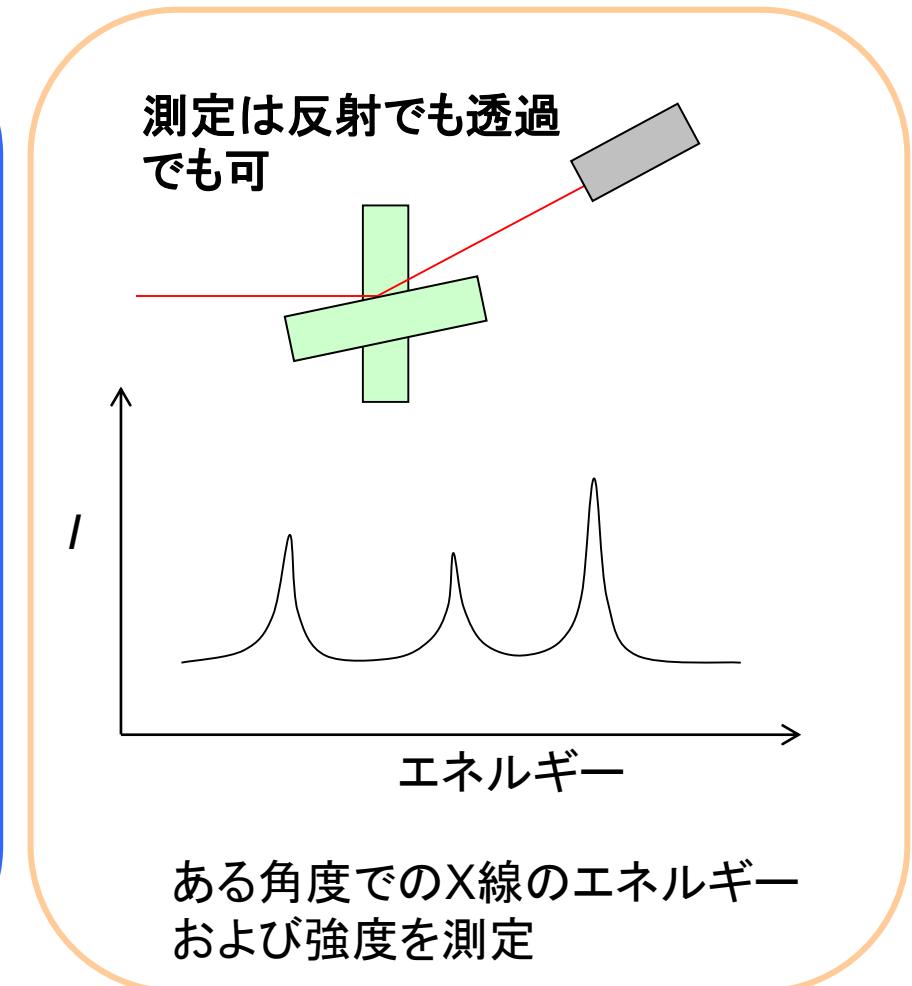


同じ面の回折光を測定しても
2θの値が変化する
↓
変化の割合から残留応力が
求まる

波長分散

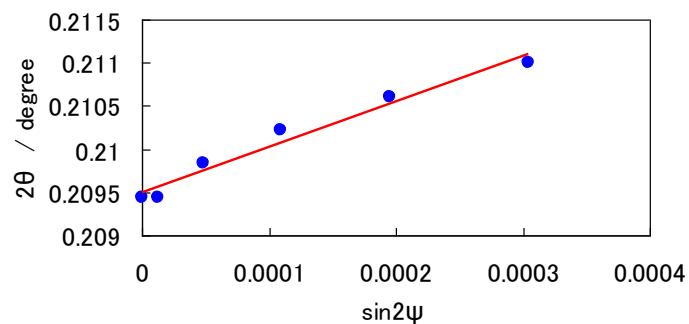
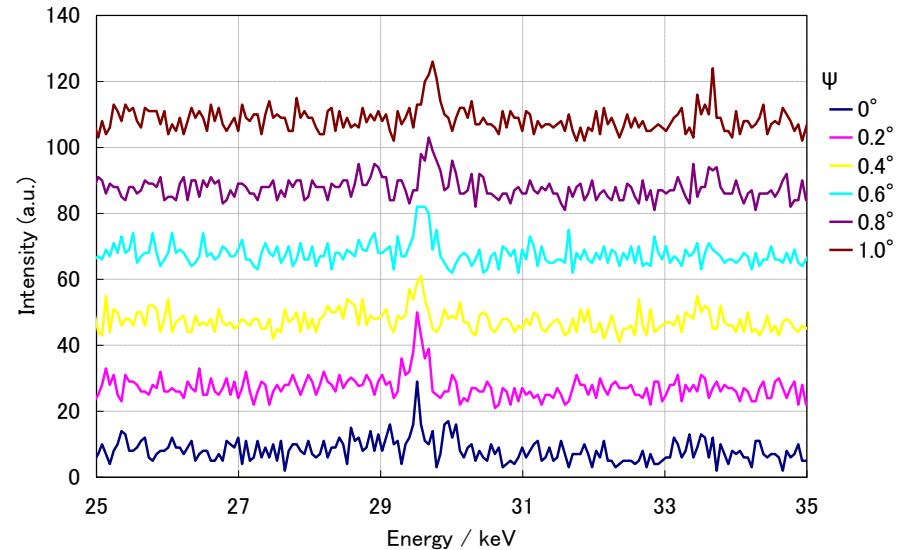
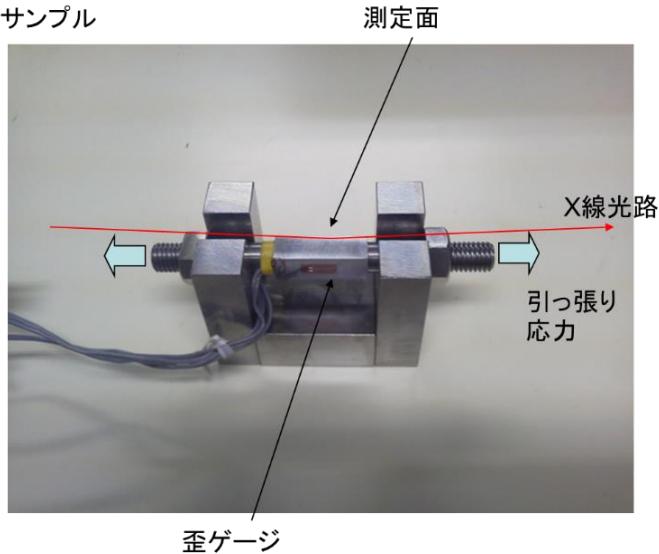


エネルギー一分散



ストレインゲージで応力を図りつつX線回折方を適用して、

測定サンプル



MIRRORCLEを用いた結果:
43.2 MPa

歪みゲージの測定結果: 41.6
MPa

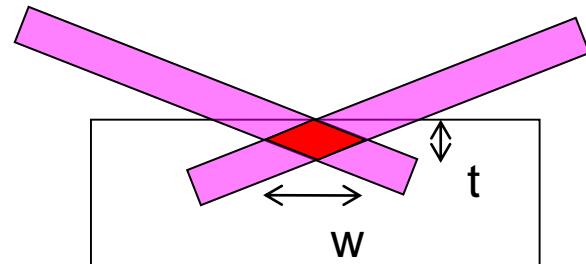
深部の残留応力評価

スリット2、3

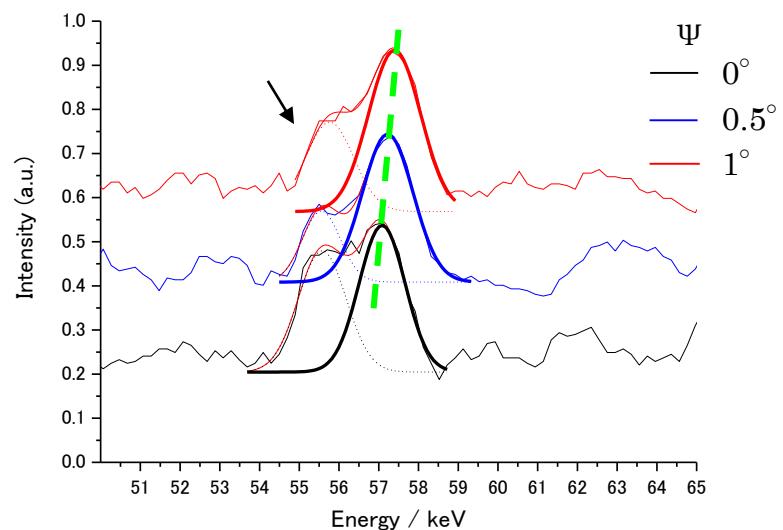
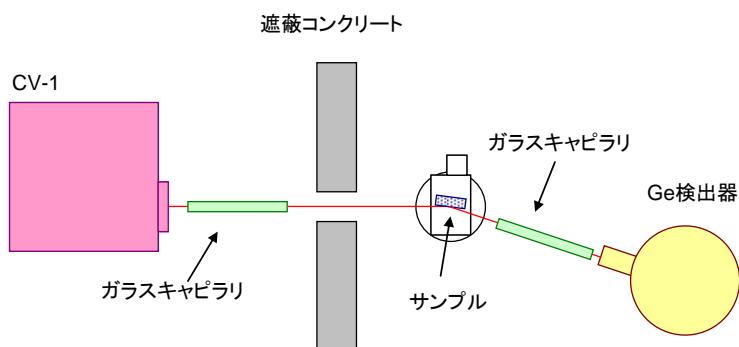


遮蔽

測定している箇所

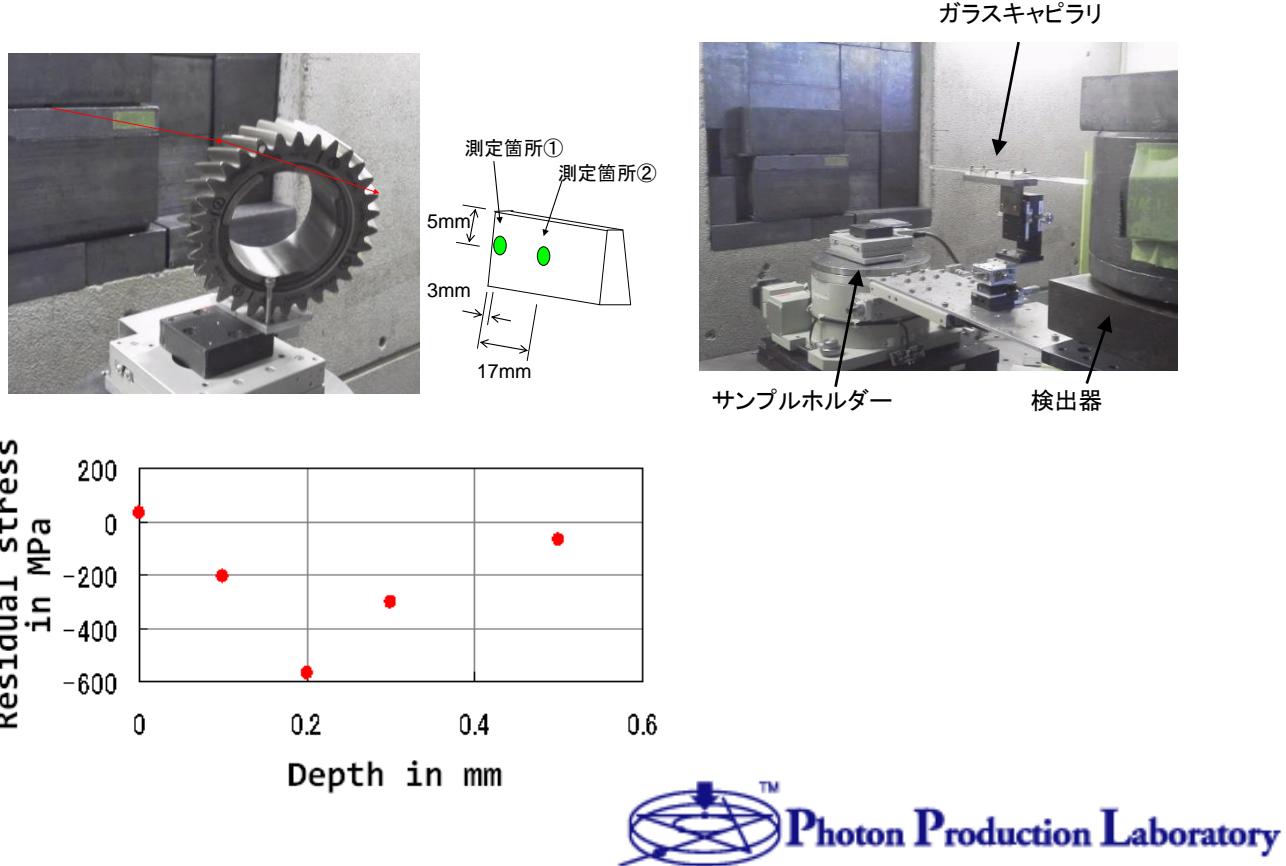


$2\theta: 2.4^\circ$
ビーム幅: 500μm
の場合、
 $t \doteq 20\text{ μm}$
 $w \doteq 500\text{ μm}$

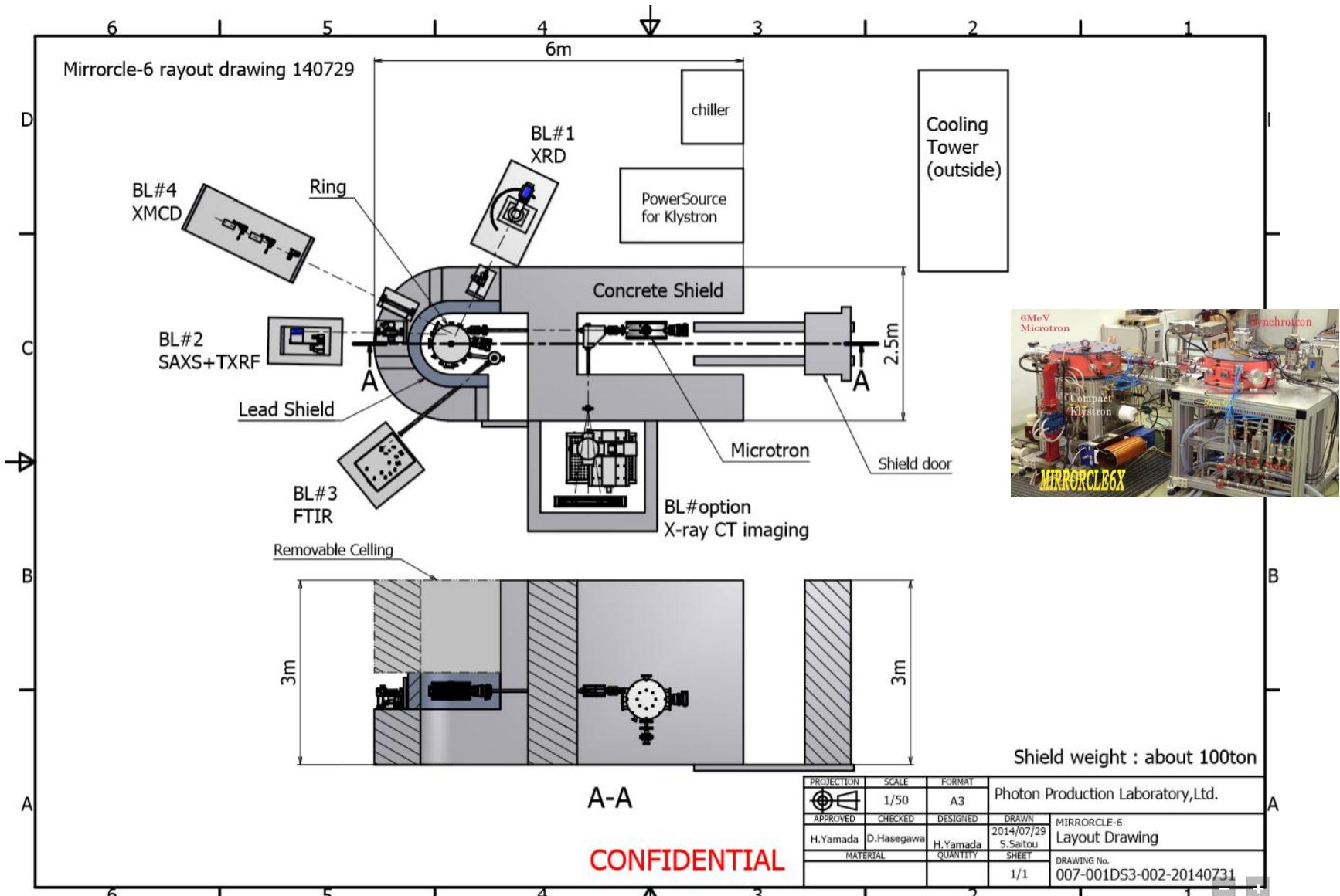


テストピースによるFe(110)回折ピーク

歯車の残留応力測定



MIRRORCLE-6XHP



マイクロトロンの特長

Photon Production Laboratory Co. Ltd.

 **Photon Production Laboratory**

Japanese
[Home](#) [Site Map](#) [contact](#)

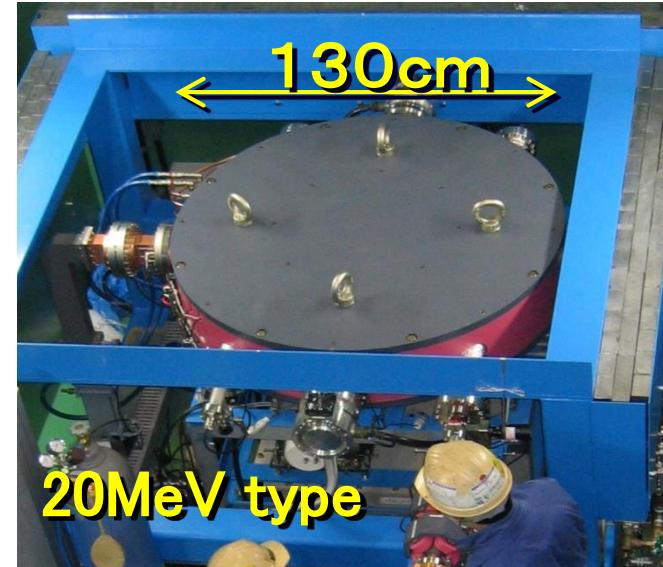
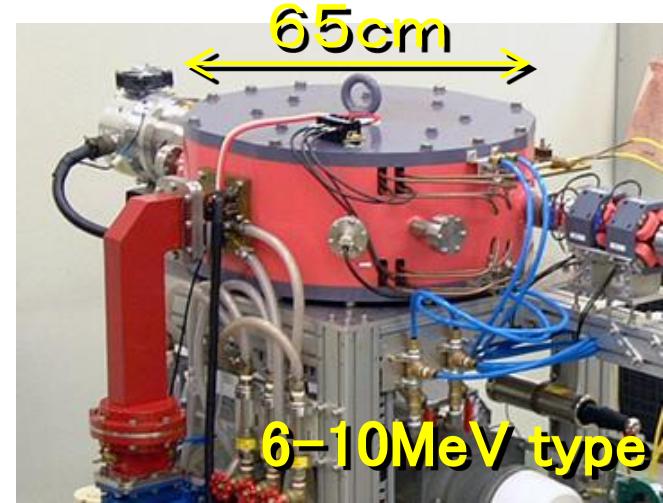
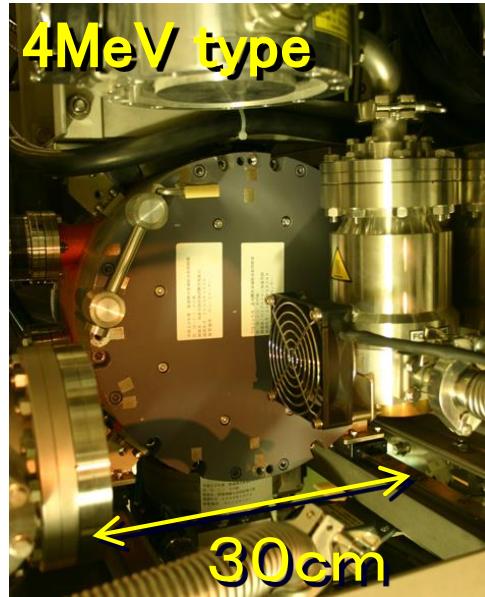
[Home](#) [Products](#) [MIRRORCLE](#) [Service](#) [Documents](#) [Company](#) [Contact](#)

"MIRRORCLE" X-ray technology
solves the problems you could not manage before.



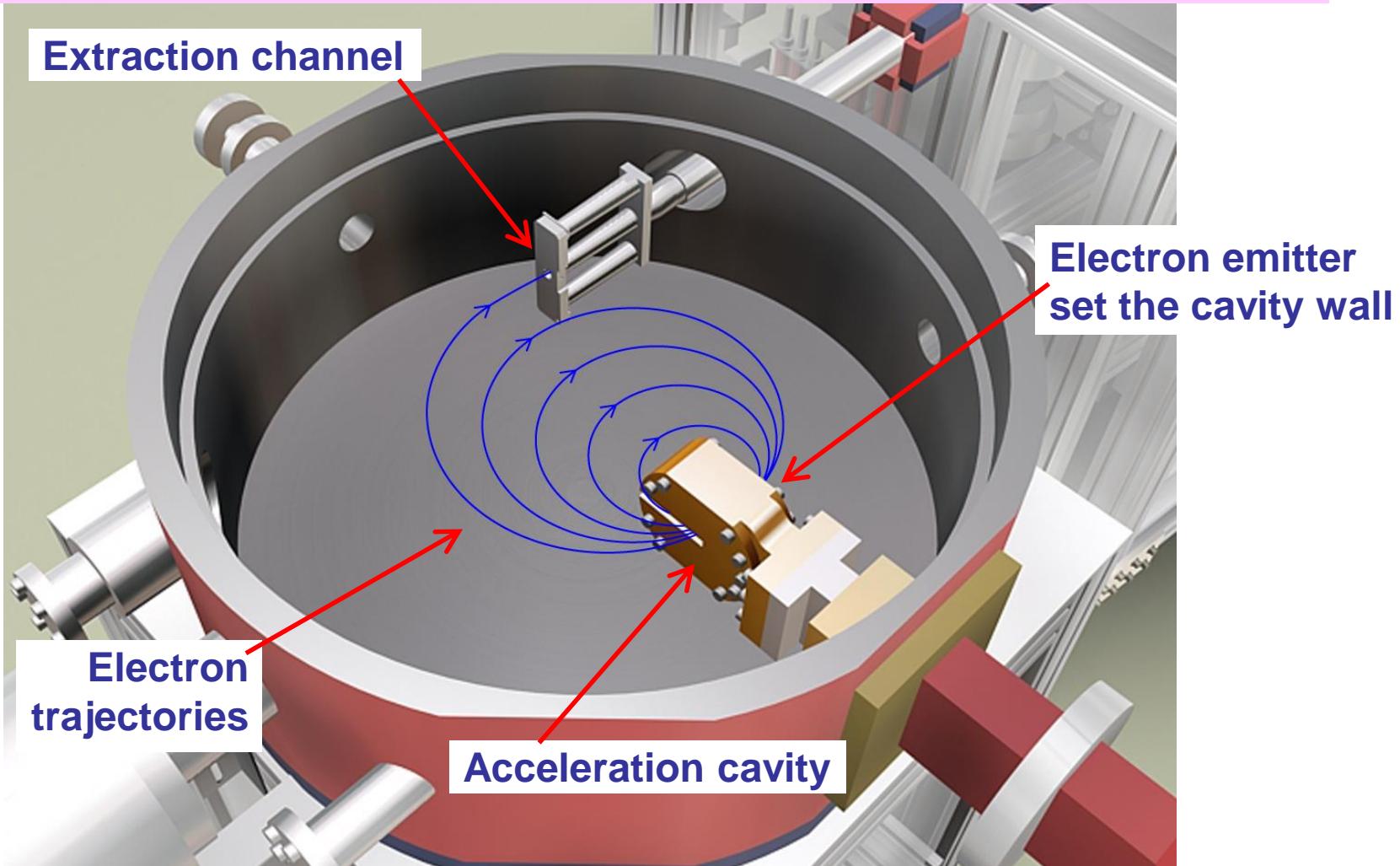

"MIRRORCLE-CV series"

MICROTRON is high quality and compact accelerator



We are experienced with 1 to 20 MeV MICROTRON as an injector of synchrotron

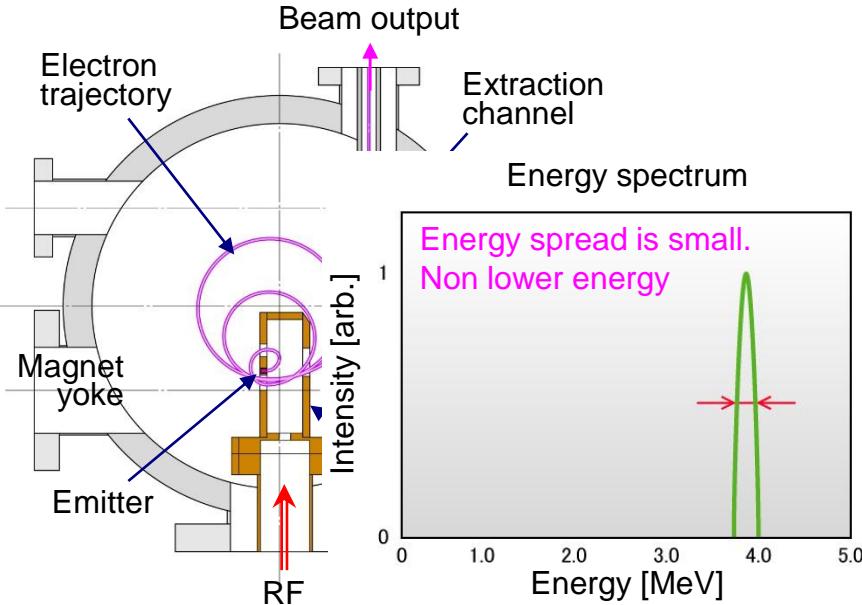
Principle of MICROTROn



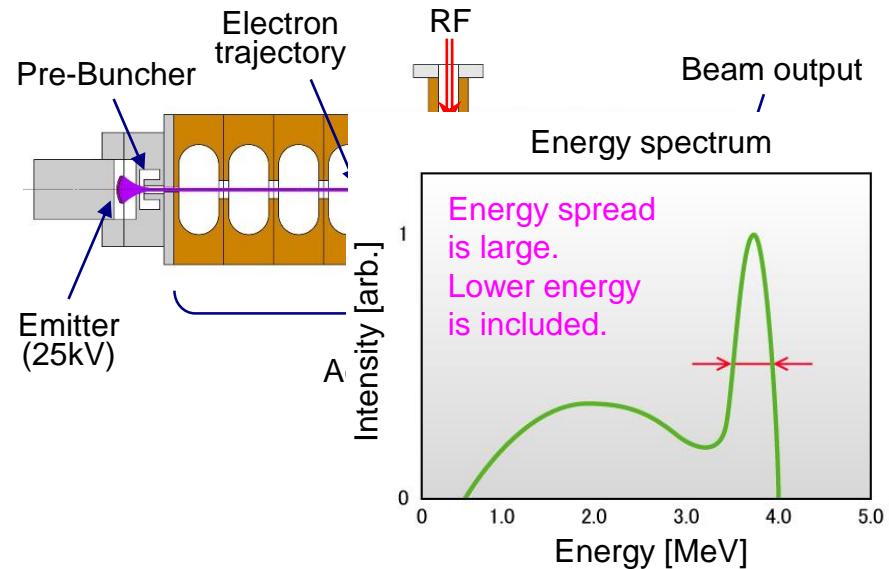
Electrons are accelerated through the cavity circulating under the uniform magnetic field and extracted to the outside when they reach the designed energy.

Comparison of microtron and linac

4MeV MICROTROON



4MeV LINAC



- 1) Electrons are emitted by RF gun.
- 2) Electrons circulate under the uniform magnetic field and are accelerated passing through the cavity.
- 3) Electrons are extracted by the magnetic shield channel after reaching the designed energy.

*Electron energy is defined by the geometry between acceleration point, extraction channel and magnetic field.

*Lower energy electrons are not extracted.

*Energy spread is less than 1%.

- 1) Electrons are emitted by 25kV high voltage.
- 2) Electrons are pre-bunched by the buncher for matching the acceleration phase in the cavity.
- 3) Electrons are accelerated passing through linear acceleration cells.

4) Electrons are extracted through the exit hole.

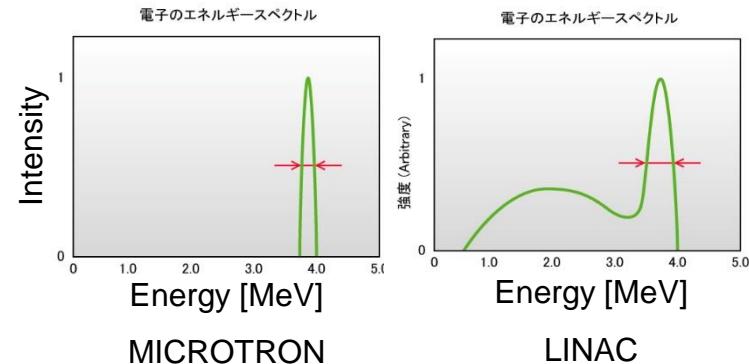
*Electron energy is defined by the RF power.

*Lower energy electrons are also accelerated.

*Energy spread is more than 4%.

Features of MICROTRON in comparison with LINAC

- ① Beam current is higher than that of LINAC.
- ② Energy spread is smaller.
- ③ Compact and not heavy.
- ④ Power consumption is higher because acceleration efficiency is higher.
- ⑤ Single cell is easier to fabricate.
- ⑥ High voltage floating terminal is unnecessary thus the handling is safer.
- ⑦ Maintenance is easier. We only change filament once a year.
- ⑧ Shielding material is reduced.



滅菌・殺菌事業の展開

Photon Production Laboratory Co. Ltd.

™ Photon Production Laboratory

Japanese
[Home](#) [Site Map](#) [contact](#)

[Home](#) [Products](#) [MIRRORCLE](#) [Service](#) [Documents](#) [Company](#) [Contact](#)

"**MIRRORCLE**" X-ray technology
solves the problems you could not manage before.

X-ray CT
XRD & SAXS
Non-Destructive Testing

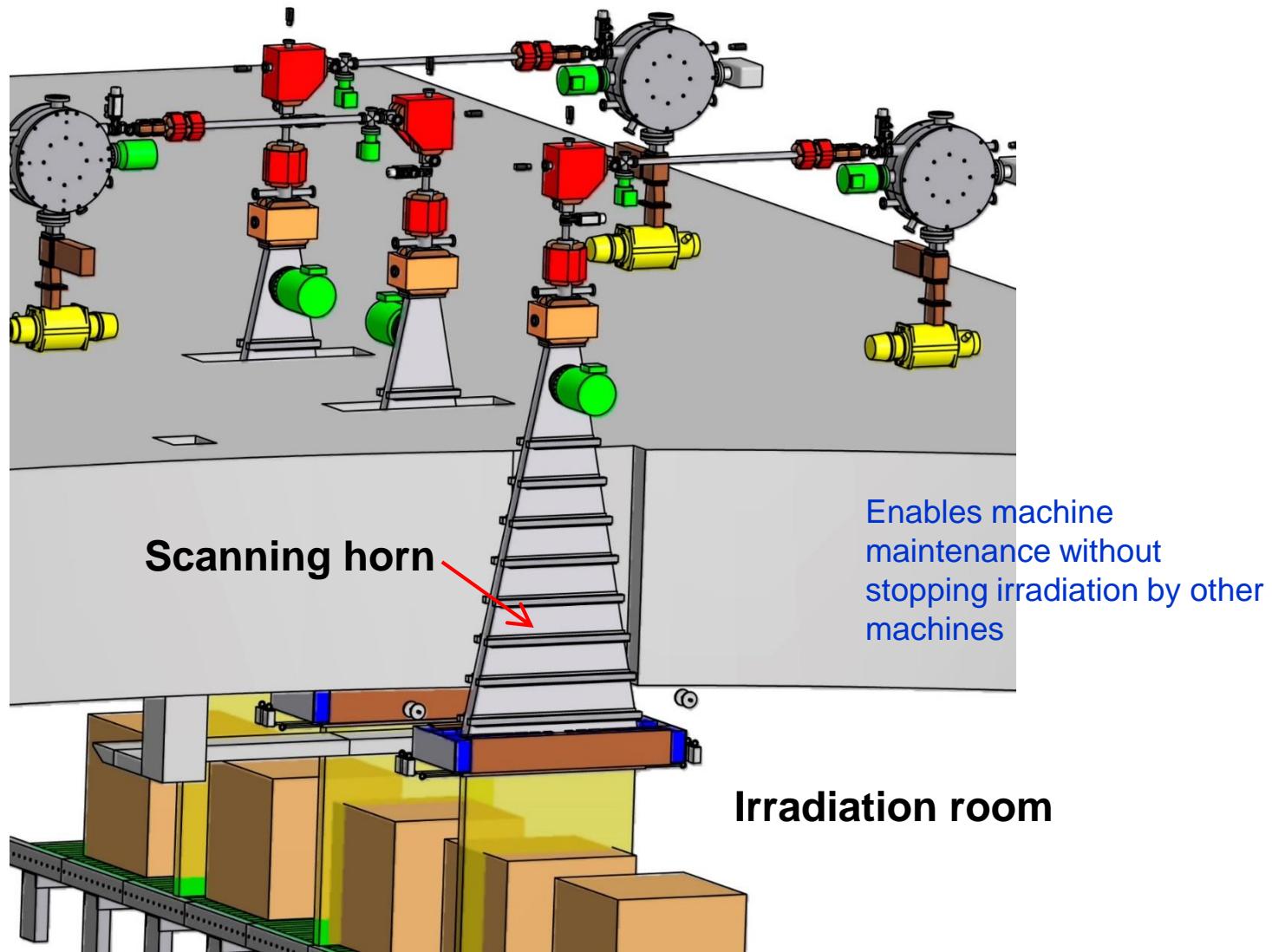


"MIRRORCLE-CV series"

30KW average by one machine is possible since peak current is high!

Model	2MeV high power type	10MeV high power type
Energy range [MV]	2	8.0 - 10.0
Pulse beam current [mA]	500	300
Pulse width [us]	5.0	5.0
Repitition rate [pps]	5,00	2,000
Average current [mA]	25	10
Beam output power [kW]	5	30
Klystron specification (model, frequency, average output power)	2,856MHz (50kW-ave)	2,856MHz (60kW-ave)
Weight (main body) [kg]	600	800
Body size	W40 x D15 cm	W40 x D60 cm
Cooling water flow [L/min]	350	400
Price (MUSD)	~3	~4

100, 200 KW irradiation is possible in tandem setup **since it is compact**



Irradiation test results by MIC1

E-beam is extracted through 50 μm thick Be window

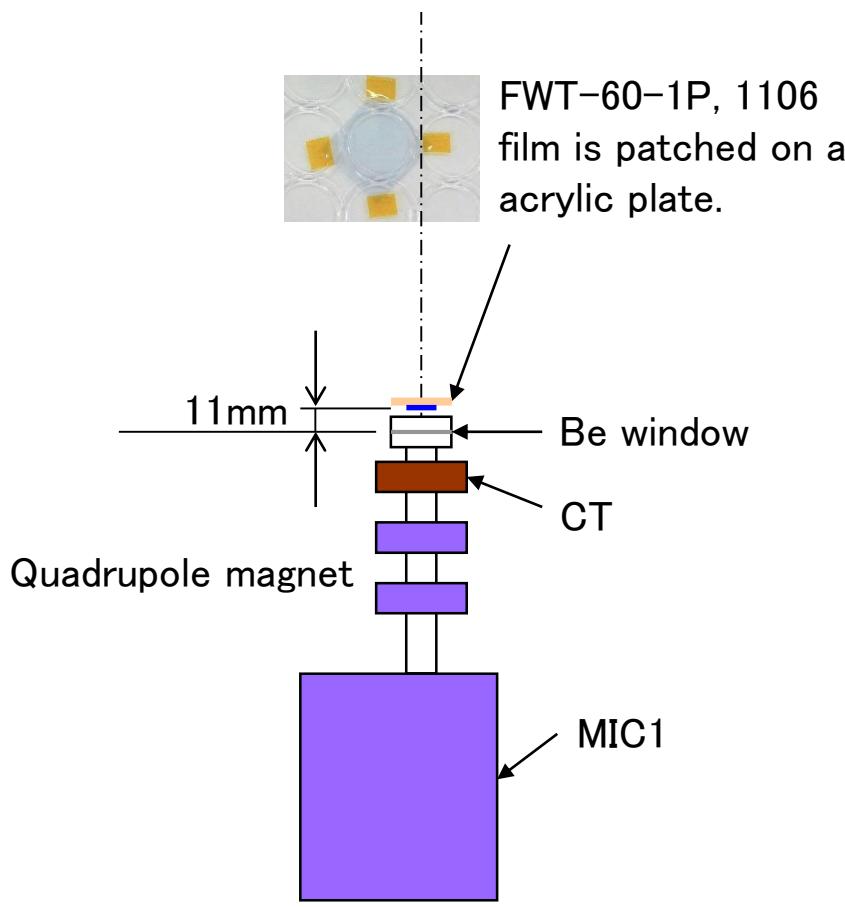
E-beam DOSE is monitored by the absorption rate in FWT-60-1P film (Batch 1106, 44.5um).

Operation parameters

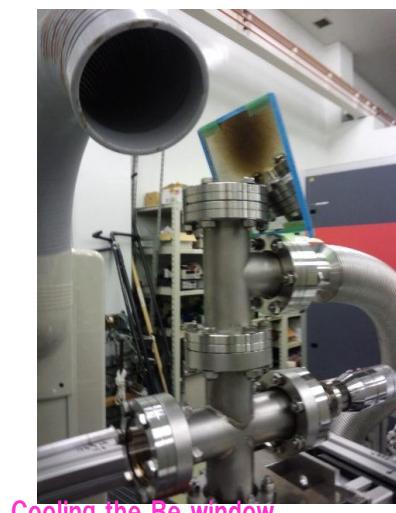
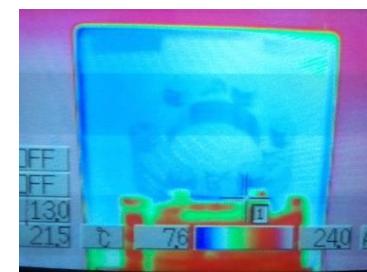
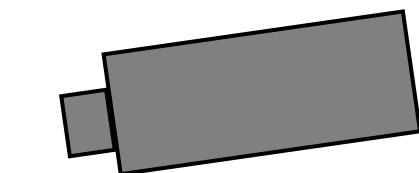
200mA, 30Hz, 200ns, 10s exposure

S-O distance

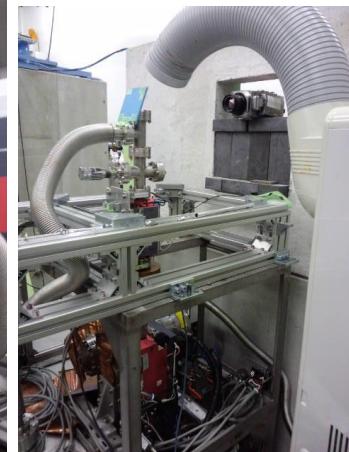
11mm



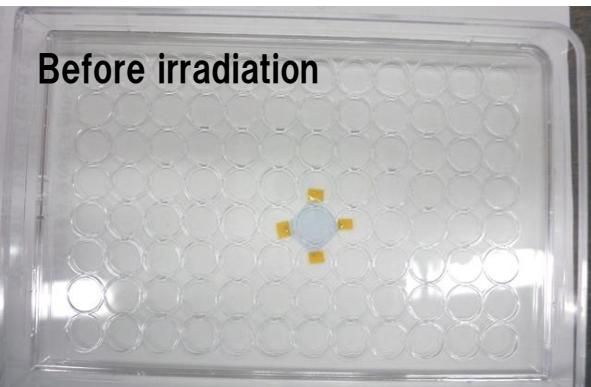
IR camera is used to monitor the temperature of window.



Cooling the Be window

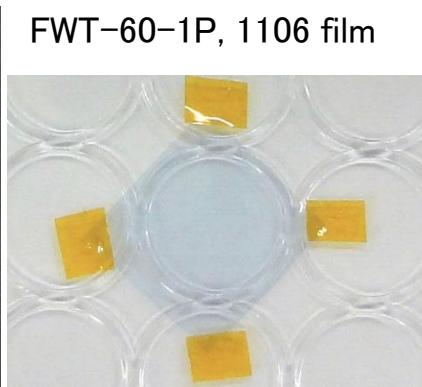


Proof of e-beam dose of 1MeV machine at 200mA, 200ns, 30Hz, 10sec (12W) irradiation



At 605nm: 0.136

At 600nm: 0.135



Before

605nm: 0.133

600nm: 0.133

After

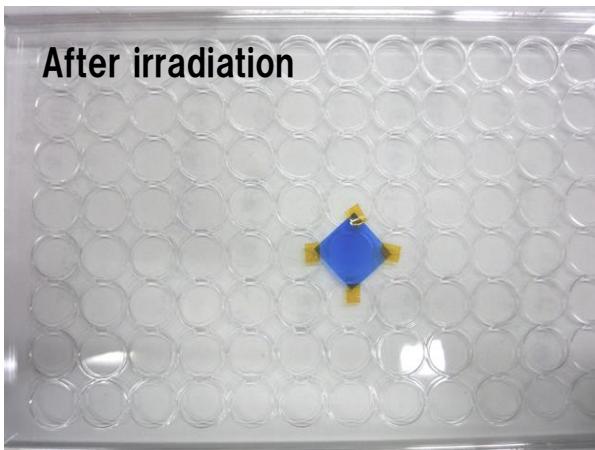
605nm: 1.648

600nm: 1.616

$$k_{605} = (1.648 - 0.133) / 0.0445 \\ = 34.045$$

$$k_{600} = (1.616 - 0.133) / 0.0445 \\ = 33.326$$

$$Q_{605} = 25.27 \text{ kGy}$$



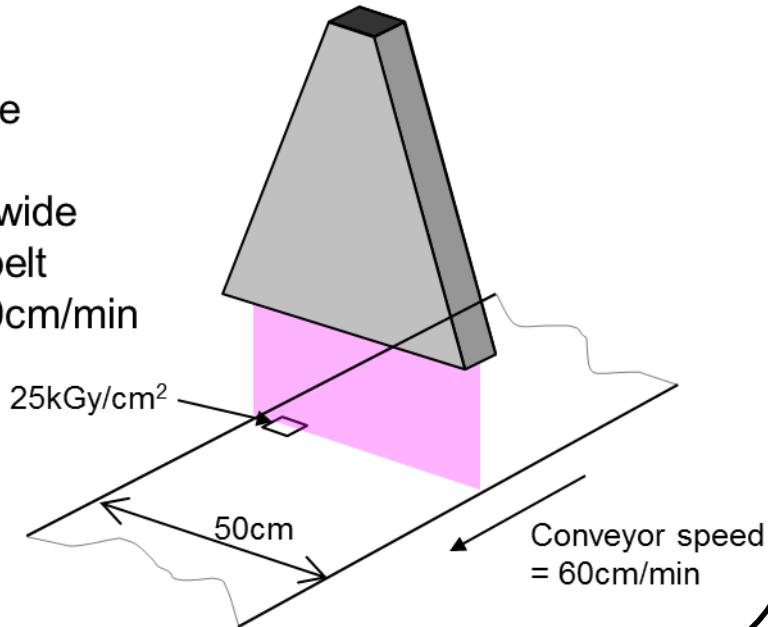
At 605nm: 1.305

At 600nm: 1.268

Co

Which enables

1kW 1MeV machine provides
25kGy/cm², 50cm wide
irradiation field at belt
conveyer speed 60cm/min



金属技研殿と提携しました

English 中文 お問い合わせはこちら TEL: 03-5365-3035

MTC Metal Technology Co. Ltd. お問い合わせはこちら TEL: 03-5365-3035

サイト内検索 powered by Google 検索

お問い合わせ

航空事業 部品修理

What's New!!

金属技研の最新情報をお届けいたします

金属加工の金属技研株式会社 TOP > What's New!!

金属積層造形

世界最大!! Giga-HIP.

技術案内

- ▶ HIP処理
- ▶ 焼結
- ▶ 接合
- ▶ 熱処理
- ▶ 特殊金属加工
- ▶ 機械加工
- ▶ 解析・分析
- ▶ 品質管理体制

金属技研のニュースリリースをお届けいたします。ご質問・ご不明な点などありましたら、お気軽に問い合わせください。

16/04/28 ゴールデンウィーク休業のご案内

16/02/08 金属技研は岐阜県土岐市に新工場を設立いたします

16/01/21 シンガポールエアショー2016に出展致します

16/01/21 3D Printing 2016に出展致します

15/12/18 冬季休業のご案内

15/10/07 「東京エアロスペースシンポジウム2015」に出展します

15/08/06 夏季休業のご案内

15/07/29 水銀ターゲット容器が国立科学博物館で展示されました

15/07/24 「第12回日本加速器学会年会」企業展示に出演します

15/07/24 「HIAT2015」企業展示に出演します

ゴールデンウィーク休業のご案内